Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

> С.М. Шандаров Н.И. Буримов А.А. Шмидт

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Методические указания по лабораторной работе для студентов технических направлений подготовки

Томск 2024

УДК 535:53(075.8) ББК 22.34я73 Ш201

Шандаров, Станислав Михайлович

Ш201 Электрооптическая модуляция оптического излучения: методические указания по лабораторной работе для студентов технических направлений подготовки / С.М. Шандаров, Н.И. Буримов, А.А. Шмидт. – Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2024. – 17 с.

Представлены методические указания по лабораторной работе для студентов технических направлений подготовки. Цель работы: ознакомление с оборудованием и методикой измерения электрооптических параметров анизотропного кристалла, а также их вычисление на основе экспериментальных данных.

Одобрено на заседании каф. ЭП, протокол № 05-24 от 08.05.2024 г.

УДК 535:53(075.8) ББК 22.34я73

© Шандаров С.М., Буримов Н.И., Шмидт А.А. 2024

© Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2024

Содержание

1 Введение	4
2 Теоретическая часть	4
2.1 Тензорное описание электрооптического эффекта	4
2.2 Линейный электрооптический эффект	6
2.2.1 Кубические нецентросимметричные кристаллы классов симмет	трии 23
и 43m	7
2.2.2 Кристаллы симметрии 4mm	7
2.2.3 Кристаллы симметрии 3m	
2.3 Распространение световых волн в среде с линейным	
двулучепреломлением при однородном внешнем поле	
2.4 Фазовый электрооптический модулятор поперечного типа	
2.5 Амплитудный электроооптический модулятор	11
3 Экспериментальная часть	13
3.1 Оборудование	13
3.2 Задание	14
3.3 Методические указания по выполнению работы	14
3.4 Содержание отчета	16
4. Контрольные вопросы	17
Список литературы	17

1 Введение

Целью работы является ознакомление с оборудованием и методикой измерения электрооптических параметров анизотропного кристалла, а также их вычисление на основе экспериментальных данных.

2 Теоретическая часть

В данном разделе будут рассмотрены теоретические основы электрооптического эффекта, который состоит в изменении оптических свойств кристаллов под действием электрического поля.

2.1 Тензорное описание электрооптического эффекта

Известное материальное уравнение перепишем в виде

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \hat{\mathbf{b}} \cdot \mathbf{D}, \qquad (2.1.1)$$

где $\hat{\mathbf{b}} = (\hat{\mathbf{\epsilon}}^r)^{-1}$ — тензор диэлектрической непроницаемости; $\hat{\mathbf{\epsilon}}^r$ — тензор относительной диэлектрической проницаемости.

Исторически сложилось, что действие внешних электрических полей на вещество принято рассматривать как изменение именно тензора диэлектрической непроницаемости среды для светового поля. Представим компоненты тензора **b** в следующем виде:

$$b_{ij} = b_{ij}^0 + \Delta b_{ij}(\mathbf{E}^0), \qquad (2.1.2)$$

где E⁰ – напряженность электрического поля, прикладываемого к веществу.

Если это поле далеко от порога разрешения или пробоя, оно приводит к небольшим изменениям оптических свойств среды, так что выполняется соотношение

$$\Delta b_{ii} \ll b_{ii} (\mathbf{E}^{\mathbf{0}}), \tag{2.1.3}$$

где b_{ii}^0 – диагональные компоненты тензора $\hat{\mathbf{b}}^0$ для невозмущенной среды.

Для случая диагонального тензора $\hat{\varepsilon}^{0}$, тензор $\hat{\mathbf{b}}^{0}$ также является диагональным:

$$b_{ij}^{0} = \frac{1}{\varepsilon_{ii}^{r}} \cdot \delta_{ij}, \quad \hat{\mathbf{b}}^{0} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\varepsilon_{11}^{r}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\varepsilon_{22}^{r}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\varepsilon_{33}^{r}} \end{vmatrix},$$
(2.1.4)

и может быть найден по обычным правилам получения обратной матрицы.

Тензор Δb_{ij} , характеризующий изменение диэлектрических свойств среды для светового излучения под действием "низкочастотного" электрического поля, можно представить в виде разложения по степеням E^0 . Опыт показывает, что достаточно ограничиваться линейными и квадратичными членами разложения:

$$\Delta b_{ij} = r_{ijk} \cdot \mathbf{E}_k^0 + R_{ijkl} \cdot \mathbf{E}_k^0 \cdot \mathbf{E}_l^0, \qquad (2.1.5)$$

Здесь первый член описывает линейный электрооптический эффект, а второй - квадратичный электрооптический эффект. Коэффициенты в разложении являются тензорами третьего (r_{ijk}) и четвертого (R_{ijkl}) рангов, а их компоненты называются соответственно электрооптическими и квадратичными электрооптическими постоянными.

Волновое уравнение, которое описывает распространение света в возмущенной среде, оперирует с тензором диэлектрической проницаемости $\hat{\varepsilon} = \varepsilon_0 \cdot \hat{\varepsilon}^r$. Можно показать, что в пренебрежении квадратичными членами выполняется соотношение

$$\Delta \varepsilon_{ij}^{r} = -\varepsilon_{ik}^{0r} \cdot \varepsilon_{jl}^{0r} \cdot \Delta b_{kl}, \ \varepsilon_{ij} = \varepsilon_{0} (\varepsilon_{ij}^{0r} + \Delta \varepsilon_{ij}^{r}).$$
(2.1.6)

2.2 Линейный электрооптический эффект

В случае кристаллов без центра симметрии тензор третьего ранга r_{ijk} отличен от нуля, и линейный электрооптический эффект (эффект Поккельса) является определяющим. В этом случае можно пренебречь в формуле (2.1.5) квадратичным членом:

$$\Delta b_{ij} = r_{ijk} \cdot \mathbf{E}_k^0. \tag{2.2.1}$$

Тензор третьего ранга r_{ijk} имеет в общем случае 27 компонент. Поскольку тензор ε_{ij} является симметричным, $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$, то и тензор r_{ijk} симметричен по перестановке первых двух индексов:

$$r_{ijk} = r_{jik} \tag{2.2.2}$$

Это дает возможность перейти от тензорных обозначений к матричным, заменив комбинацию индексов іј на один индекс (например, m) по правилам:

11 \leftrightarrow 1, 22 \leftrightarrow 2, 33 \leftrightarrow 3, 23,32 \leftrightarrow 4, 13,31 \leftrightarrow 5, 12,21 \leftrightarrow 6 (2.2.3) Эти правила легко запомнить для случая тензора второго ранга:

$$\begin{vmatrix} 1 & -6 & -5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 11 & -12 & -13 \\ 0 & 22 & 23 \\ 0 & 0 & 33 \end{vmatrix}$$
(2.2.4)

Таким образом, в общем случае матрица электрооптических коэффициентов может быть представлена в виде таблицы 6×3 . Симметрия кристалла накладывает ограничения на электрооптические коэффициенты. Многие из них оказываются равными нулю, некоторые коэффициенты связаны друг с другом определенными соотношениями. Рассмотрим конкретный вид матрицы r_{mk} для некоторых кристаллов.

2.2.1 Кубические нецентросимметричные кристаллы классов симметрии 23 и 43m

Кристаллы такой симметрии имеют один независимый электрооптический коэффицент $r_{123} = r_{213} = r_{312} = r_{321} = r_{132}$, то есть $r_{41} = r_{52} = r_{63}$:

$$r_{mk} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ r_{41} & 0 & 0 \\ 0 & r_{41} & 0 \\ 0 & 0 & r_{41} \end{vmatrix}.$$
 (2.2.5)

Сюда относятся кристаллы GaAs, $Bi_{12}SiO_{20}$, $Bi_{12}GeO_{20}$, $Bi_{12}TiO_{20}$ и другие. Для кристаллов $Bi_{12}TiO_{20}$ и $Bi_{12}SiO_{20}$ $r_{41} = 5 \cdot 10^{-12}$ м/В. Для других кристаллов кубической сингонии электрооптические коэффициенты имеют меньше значения.

2.2.2 Кристаллы симметрии 4mm

Такие кристаллы являются одноосными, характеризуются тремя независимыми электрооптическими коэффициентами $r_{113} = r_{223}(r_{13} = r_{23}), r_{333}(r_{33}),$ $r_{232} = r_{322} = r_{131} = r_{311}(r_{42} = r_{51}),$ то есть

	0	0	r_{13}
	0	0	r_{13}
14	0	0	r_{33}
$r_{mk} =$	0	r_{42}	0
	r ₄₂	0	0
	0	0	0

К этому классу относятся сегнетоэлектрические кристаллы BaTiO₃; стронций-бариевый ниобат (Sr_xBa_{1-x}Nb₂O₆), кратко SBN, и другие. Для BaTiO₃ $r_{42} = 730 \cdot 10^{-12}$ м/B, $r_{33} = 46 \cdot 10^{-12}$ м/B, $r_{13} = 10.2 \cdot 10^{-12}$ м/B, то есть имеется большая анизотропия электрооптического эффекта. "Недиагональный" коэффициент r_{42} более чем на 2 порядка превосходит электрооптический коэффициент кубических кристаллов. Для SBN при x = 0.75 $r_{33} = 237 \cdot 10^{-12}$ м/В, $r_{13} = 37 \cdot 10^{-12}$ м/В. Отметим, что эти коэффициенты зависят и от длины световой волны, то есть имеет место дисперсия электрооптических постоянных.

2.2.3 Кристаллы симметрии 3m

Данные кристаллы также являются одноосными, к ним относятся ниобат лития (LiNbO₃) и танталат лития (LiTaO₃). Матрица электрооптических коэффициентов имеет вид

$$r_{mk} = \begin{vmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$
 (2.2.7)

Для LiNbO₃, при $\lambda = 633$ нм, $r_{22} = 3.4 \cdot 10^{-12}$ м/B, $r_{13} = 8.6 \cdot 10^{-12}$ м/B, $r_{33} = 30.8 \cdot 10^{-12}$ м/B, $r_{51} = 28 \cdot 10^{-12}$ м/B.

2.3 Распространение световых волн в среде с линейным двулучепреломлением при однородном внешнем поле

Ограничимся анализом распространения плоских монохроматических световых волн с волновым вектором $\mathbf{k} = k_0 \cdot n \cdot \mathbf{m}$ и вектором поляризации $\mathbf{E} = \mathbf{E}_m \mathbf{e}$, где $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}$, λ - длина световой волны, n - показатель преломления для данной световой волны, \mathbf{m} и \mathbf{e} - единичные векторы волновой нормали и поляризации с компонентами m_k и e_k . В этом случае волновое уравнение приводит к следующей системе уравнений для собственных волн

$$\left[n^{2}(\delta_{mk}-m_{m}m_{k})-\varepsilon_{mk}^{r}\right]\cdot e_{k}=0, \qquad (2.3.1)$$

где в соответствии с соотношением (2.1.6) ε_{mk}^{r} имеет вид

$$\varepsilon_{mk}^{r} = \varepsilon_{mk}^{r^{0}} - \varepsilon_{mi}^{r^{0}} \varepsilon_{kj}^{r^{0}} r_{ijk} \mathbf{E}_{k}^{0}, \qquad (2.3.2)$$

Здесь мы считаем поле E_k^0 заданным и однородным, и пренебрегаем квадратичным электрооптическим эффектом.

Рассмотрим распространение волн вдоль оси х в кристалле ниобата лития, к которому внешнее поле приложено вдоль оси z (рисунок 2.1).



Рисунок 2.1 – Распространение волн в кристалле во внешнем электрическом поле

В этом случае, в соответствии с формулами (2.1.6), (2.2.1) и (2.2.7), тензор ∆€ будет диагональным:

$$\Delta \varepsilon_{11} = -n_0^4 r_{13} \mathrm{E}_3^0, \qquad (2.3.3)$$

$$\Delta \varepsilon_{22} = -n_0^4 r_{13} \mathcal{E}_3^0, \qquad (2.3.4)$$

$$\Delta \varepsilon_{33} = -n_0^4 r_{33} \mathcal{E}_3^0, \qquad (2.3.5)$$

$$\varepsilon_{11}^{0r} = \varepsilon_{22}^{0r} = n_0^2, \ \varepsilon_{33}^{0r} = n_e^2, \tag{2.3.6}$$

где n_0 и n_e - обыкновенный и необыкновенный показатели преломления кристалла.

Вектор **m** имеет компоненты $m_1 = 1$, $m_2 = m_3 = 0$, и уравнение (2.3.1) принимает вид

$$\begin{cases} -\varepsilon_{11}^{r}e_{1} = 0, \\ (n^{2} - \varepsilon_{22}^{r})e_{2} = 0, \\ (n^{2} - \varepsilon_{33}^{r})e_{3} = 0. \end{cases}$$
(2.3.7)

Отсюда находим, учитывая соотношения (2.3.3)-(2.3.6):

$$\begin{cases} e_1 = 0, \\ n_1^2 = \varepsilon_{22}^r = n_0^2 - n_0^4 r_{13} E_3^0, \quad e_2^{(1)} = 1; \\ n_2^2 = \varepsilon_{33}^r = n_e^2 - n_e^4 r_{33} E_3^0, \quad e_3^{(2)} = 1. \end{cases}$$
(2.3.8)

10

Таким образом, одна собственная волна имеет обыкновенную поляризацию (вектор $e^{(1)}$ ориентирован вдоль оси у) и показатель преломления n_1 :

$$n_1 = n_0 + \Delta n_0, \Delta n_0 \cong -\frac{n_0^3 r_{13}}{2} E_3^0 = -\frac{n_0^3 r_{13}}{2} \cdot \frac{U}{d}.$$
(2.3.9)

Вторая собственная волна имеет необыкновенную поляризацию (вектор $e^{(2)}$ направленный вдоль оси z) и показатель преломления

$$n_2 = n_e + \Delta n_e, \Delta n_0 \cong -\frac{n_e^3 r_{33}}{2} E_3^0 = -\frac{n_0^3 r_{33}}{2} \cdot \frac{U}{d}$$
(2.3.10)

В случае входной световой волны с произвольной поляризацией поле в кристалле будет представлять линейную суперпозицию двух собственных волн – обыкновенной и необыкновенной.

2.4 Фазовый электрооптический модулятор поперечного типа

Конструкция фазового модулятора поперечного типа имеет вид, изображенной на рисунке 2.1. В случае распространения необыкновенно поляризованной волны имеем

$$\mathbf{E}(\mathbf{l},\mathbf{t}) = \mathbf{E}_{3m} \mathbf{z}^{\mathbf{0}} \exp\left[i(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} n_e l\right] \exp\left[-i\frac{2\pi}{\lambda}\Delta n(t)l\right] =$$

$$= \mathbf{E}_{3m} \mathbf{z}^{\mathbf{0}} \exp\left[i(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} n_e l\right] \exp\left[i\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{n_e^3 r_{33}}{2}U(t)\frac{l}{d}\right]$$
(2.4.1)

Таким образом, световая волна на выходе модулятора приобретает фазовую модуляцию с величиной фазового сдвига

$$\Psi(t) = -\frac{2\pi}{\lambda} \Delta n(t) l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{n_e^3 r_{33}}{2} U(t) \frac{l}{d}$$
(2.4.2)

Качество материала модулятора, определяемое только его физическими свойствами, характеризуется величиной $n_e^3 r_{33}$. Для ниобата лития

рассмотренная ориентация внешнего поля и поляризация света являются оптимальными, поскольку r_{33} имеет самую большую величину. При поляризации света вдоль оси у качество материала будет определяться параметром $n_0^3 r_{13}$, примерно в три раза меньшим, чем $n_e^3 r_{33}$.

Величина *l/d* определяется размерами кристалла и светового пучка и для объемного модулятора может составлять ~10÷30, при апертуре пучка ~1мм и длине кристалла ~10÷30мм. Для электрооптических модуляторов на полосковых волноводах эта величина, *l/d*, как минимум на порядок больше.

Очень часто в качестве характеристики фазового модулятора используют полуволновое напряжение $U_{l/2}$ – напряжение, при котором дополнительный фазовый сдвиг Ψ модулятора равен π . Обычно оно составляет сотни вольт.

2.5 Амплитудный электроооптический модулятор

Рассмотрим световую волну на входе устройства, изображенного на рисунке 2.1, при ее поляризации под углом 45⁰ к осям z и y. В этом случае поле на выходе кристалла будет иметь две составляющие

$$E_{z}(l,t) = \frac{E_{m}}{\sqrt{2}} \exp(i\omega t) \exp(-i\frac{2\pi}{\lambda}n_{e}l) \exp(-i\frac{2\pi}{\lambda}\Delta n_{e}l), \qquad (2.5.1)$$

$$E_{y}(l,t) = \frac{E_{m}}{\sqrt{2}} \exp(i\omega t) \exp(-i\frac{2\pi}{\lambda}n_{0}l) \exp(-i\frac{2\pi}{\lambda}\Delta n_{0}l), \qquad (2.5.2)$$

равные по амплитуде, и имеющие как постоянный фазовый сдвиг

$$\Gamma_{0e} = \frac{2\pi}{\lambda} (n_0 - n_e)l, \qquad (2.5.3)$$

так и зависящий от приложенного напряжения

$$\Gamma(t) = \frac{2\pi}{\lambda} \Big[\Delta n_0(t) - \Delta n_{e(t)} \Big] l = \frac{2\pi}{\lambda} \Big(n_e^3 r_{33} - n_0^3 r_{13} \Big) \frac{U(t)}{2d} l \,.$$
(2.5.4)

Для нормальной работы амплитудного модулятора постоянный фазовый сдвиг Γ_{0e} нужно довести до значения $\pi\rho$, где ρ - целое число. Это можно сделать с помощью четвертьволновой пластинки, представляющей х- или усрез одноосного кристалла с толщиной, $t = \lambda/4(n_0 - n_e)$ и осуществляющей фазовый сдвиг между обыкновенной и необыкновенной волнами. Чаще всего для этого используют тонкие пластины слюды, толщину которых можно подобрать их расщеплением. Поворачивая такую пластинку на некоторый угол, можно изменять вносимый ею фазовый сдвиг от $-\pi/2$ до $\pi/2$. Тогда на выходе системы (рисунок 2.2) будет иметь место линейная поляризация светового поля, которую можно определить анализатором А.



Рисунок 2.2 – Схема электрооптического модулятора

Таким образом, при U = 0 интенсивность выходного излучения будет равна нулю. При $U=U_{l/2}$ она будет максимальна, а амплитудная характеристика пропускания модулятора будет иметь вид

$$T(t) = \frac{I_{gbax}(t)}{I_{gax}} = \sin^2 \frac{\Gamma(t)}{2} = \sin^2 \left\{ \frac{\pi}{2} \cdot \frac{U(t)}{U_{\lambda/2}} \right\},$$
(2.5.5)

где

$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda d}{(n_e^3 r_{33} - n_0^3 r_{13})l}.$$
 (2.5.6)

Амплитудная характеристика модулятора изображена на рисунке 2.3, где для обеспечения линейности к модулятору приложено постоянное смещающее напряжение $U_{l/4}$.



Рисунок 2.3 – Амплитудная характеристика модулятора

3 Экспериментальная часть

3.1 Оборудование

Для выполнения лабораторной работы необходимо следующее напряжения, оборудование: лазер, источник исследуемый кристалл, четвертьволновая пластинка, анализатор, фотодиод, амперметр. Схема экспериментальной установки показана на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 – Схема экспериментальной установки 1 – лазер; 2 – источник напряжения; 3 – исследуемый кристалл; 4 – четвертьволновая пластинка; 5 – анализатор; 6 – фотодиод; 7 – амперметр

3.2 Задание

- Рассчитать теоретически полуволновое напряжение для исследуемого кристалла;
- Собрать и настроить экспериментальную установку согласно вышеприведенной схеме;
- Построить экспериментальную зависимость интенсивности регистрируемого света от напряжения, прикладываемого поля к кристаллу;
- 4. Определить по полученной экспериментальной зависимости полуволновое напряжение и сравнить его с рассчитанным значением.
- 5. Линеаризовать полученную зависимость и рассчитать электрооптический коэффициент и сравнить с табличным значением.

3.3 Методические указания по выполнению работы

При теоретическом расчете полуволнового напряжения необходимо учесть, что в экспериментальной установке реализуется поперечный электрооптический эффект, для которого искомое напряжение определяется выражением (2.5.6).

Параметры исследуемого кристалла 27,5 х 11,4 х 2,55 (мм); $n_0 = 2,286$; $n_e = 2.196$.

В данной работе измеряется линейный электрооптический коэффициент *r* для кристалла ниобата лития, соответствующий направлению распространению света вдоль кристаллографической оси Z, причем направление поляризации совпадает с направлением поля и с направлением кристаллографической оси X. Линейный электрооптический коэффициент при такой геометрии взаимодействия максимален и в литературе обозначается как *r*₃₃.

Для настройки экспериментальной установки необходимо установить все элементы схемы, как показано на рисунке 3.1, включить лазер. Убедитесь, что напряжение, прикладываемое к кристаллу равно нулю. Поворачивая лазер вокруг оси (направление распространения света), установить поляризацию лазерного излучения равную 45[°] (рисунок 2.2, поляризацию можно проверить с помощью анализатора, поставив его перед кристаллом, на отметке 45[°] интенсивность должна быть минимальной).

Установить поляризацию анализатора 5 таким образом, чтобы показания фотодиода были максимальными. Записать значение фототока (*I*₀).

Установить поляризацию анализатора 5 таким образом, чтобы показания фотодиода были минимальными. Кристалл оптически неоднороден, что связано с технологией его выращивания, поэтому даже в отсутствие поля интенсивность света после анализатора не равна нулю (паразитное изменение поляризации).

Подать внешнее напряжение на кристалл и, изменяя напряжение от 0 В до 300 В, снять зависимость фототока *I* от напряжения *U*.

Зависимость интенсивности света от напряжения I(U), определяется следующим выражением:

$$I(U) = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi l r n^3}{2\lambda d} U \right)$$
(3.3.1)

Видно, что зависимость (3.3.1) является нелинейной. Преобразуем эту зависимость в линейную:

$$\arcsin\sqrt{\frac{I}{I_0}} = mU \tag{3.3.2}$$

Если построить зависимость $\arcsin \sqrt{\frac{I}{I_0}} = f(U)$, то это будет прямая с

углом наклона, определяемым коэффициентом *m*.



Рисунок 3.2 – Пример зависимости = f(U)

Определив графически *m*, можно найти электрооптический коэффициент

r:

$$r = \frac{2m\lambda d}{\pi n^3 l} \tag{3.3.3}$$

где λ - длина волны света в вакууме, d – расстояние между электродами, l –

длина среды, *n* – показатель преломления в отсутствии поля (*n*₀).

Полученные результаты удобнее записать в таблицу следующего типа:

<i>U</i> , B	<i>I</i> , мкА	I/I_0	$\arcsin\sqrt{\frac{I}{I_0}}$

3.4 Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- 1. титульный лист;
- 2. введение;
- 3. описание макета, и методику измерений;
- 4. основные расчетные соотношения;
- 5. результаты работы и их анализ;
- 6. выводы;
- 7. список используемой литературы.

4. Контрольные вопросы

- 1. Что такое линейный электрооптический эффект?
- 2. В чем отличие двуосного кристалла от одноосного?
- Выполняются ли законы геометрической оптики для необыкновенного луча?
- 4. В чем отличие продольного электрооптического эффекта от поперечного?
- 5. Зачем нужна поляризационная пластина в экспериментальной установке?
- 6. Как из результатов работы определить значение электрооптического коэффициента?

Список литературы

- 1. Бутиков Е. И. Оптика.- М: Высш. шк., 1986.
- Байбородин Ю.В. Электрооптический эффект в кристаллах и его применение в приборостроении. – М., 1967